

| | | |
|---|--------------------------------------|----------------------------|
| K-Nr.: K-no.: | Speicherdrossel / Storage Choke | Datum: 19.05.1998 Date: |
| Kunde: Typenelement / Standard Type Customer | Kd. Sach Nr.: Customers part no.: | Seite 1 von 1 Page of |

Maßbild (mm):
Mechanical outline

Freimaßtoleranz DIN ISO 2768-c
General tolerances

Toleranz der Stiftabstände ±0,3mm
(Tolerances grid distance)

DC = Date Code
F = Factory

Beschriftung:
(marking)

004
DC F

Anschlüsse:
Connections:
Cu-verzinkt Ø 1,0 mm
Cu-tinned

Anschlußschema:
Schematic diagram

ü = 1 : 1

Betriebsdaten/Charakteristische Daten (Richtwerte):
Operational data/characteristic data (nominal values):

$I_N = 4 \text{ A}$ $L = 44 \mu\text{H}$ ($N_I + N_{II}$ in Reihe/series)
 $I_N = 8 \text{ A}$ $L = 11 \mu\text{H}$ ($N_I + N_{II}$ parallel)

$\Delta I = 0,2 \cdot I_N$

$f \leq 200 \text{ kHz}$ $\tau_{\text{max}} \geq 0,25$

Umgebungstemperatur/ambient temperature: $-40 \text{ }^\circ\text{C} \dots + 60 \text{ }^\circ\text{C}$
 Lagertemperatur/storage temperature: $-40 \text{ }^\circ\text{C} \dots + 125 \text{ }^\circ\text{C}$

Endprüfung: (V: 100%-Test; AQL...: DIN ISO 2859-Teil1)
Final inspection

| | | | | | |
|----|------------|--------|--|--------------------------|--|
| 1) | (V) | M3014: | $U_{p,\text{eff}} = 0,5 \text{ kV}$, | 1 s, | N_I gegen/to N_{II} |
| 2) | (AQL 0,25) | M3214: | $L = 44 \mu\text{H} + 25\% - 10\%$, | $I_{DC} = 4 \text{ A}$, | $f = 10 \text{ kHz}$, $U_{AC,\text{eff}} = 250 \text{ mV}$ ($N_I + N_{II}$ in Reihe/series) |
| 3) | (AQL 1/S4) | | $R_{Cul} = R_{Cull} \leq 13 \text{ m}\Omega$ | | |
| 4) | (AQL 1/S4) | M3029: | Lötbarkeitstest Soldering test | | |

Messungen nach Temperaturangleich der Prüflinge an Raumtemperatur
Measurements after temperature balance of the test samples at room temperature

Weitere Vorschriften: Anschlußsträger UL-gelistet
Applicable documents: Terminal UL-listed

| Datum | Name | Index | Änderung |
|----------|------|-------|---|
| 19.05.98 | Tr. | 80 | Maßbild, Betriebsdaten aktualisiert. Beschriftung geändert. Endprüfung Pkt2) aktualisiert. Endprüfung Pkt.1), Prüfzeit auf 1s reduziert. Werte entgültig festgelegt. |

| | | | |
|---------------------------|------------------------|-----------------------|-------------------------|
| Hrsg.: KB-FB FT editor | Bearb: Tr. designer | KB-PM B: Dö. check | freig.: Tr. released |
|---------------------------|------------------------|-----------------------|-------------------------|

Данный компонент на территории Российской Федерации

Вы можете приобрести в компании MosChip.

Для оперативного оформления запроса Вам необходимо перейти по данной ссылке:

<http://moschip.ru/get-element>

Вы можете разместить у нас заказ для любого Вашего проекта, будь то серийное производство или разработка единичного прибора.

В нашем ассортименте представлены ведущие мировые производители активных и пассивных электронных компонентов.

Нашей специализацией является поставка электронной компонентной базы двойного назначения, продукции таких производителей как XILINX, Intel (ex.ALTERA), Vicor, Microchip, Texas Instruments, Analog Devices, Mini-Circuits, Amphenol, Glenair.

Сотрудничество с глобальными дистрибьюторами электронных компонентов, предоставляет возможность заказывать и получать с международных складов практически любой перечень компонентов в оптимальные для Вас сроки.

На всех этапах разработки и производства наши партнеры могут получить квалифицированную поддержку опытных инженеров.

Система менеджмента качества компании отвечает требованиям в соответствии с ГОСТ Р ИСО 9001, ГОСТ РВ 0015-002 и ЭС РД 009

Офис по работе с юридическими лицами:

105318, г.Москва, ул.Щербаковская д.3, офис 1107, 1118, ДЦ «Щербаковский»

Телефон: +7 495 668-12-70 (многоканальный)

Факс: +7 495 668-12-70 (доб.304)

E-mail: info@moschip.ru

Skype отдела продаж:

moschip.ru

moschip.ru_4

moschip.ru_6

moschip.ru_9